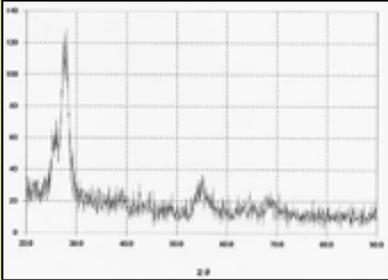
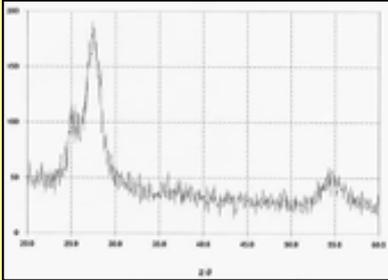


タイトル	薄膜の性能の違いの原因を調べました	
事例	酸化チタン薄膜が作製条件によって光触媒性能が違う原因を調べました	
試験内容と結果	<p>湿式法で作製した酸化チタン薄膜は加熱温度など作製条件によって、光を当てた時の曇り防止など光触媒性能が異なった。薄膜X線回折装置により、その結晶型を調査したところ、酸化チタンの結晶型が異なっていた。結晶型の違いが性能に関連するもの推測された。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>サンプルA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>サンプルB</p> </div> </div>	
使用した装置	<p>薄膜X線回折装置 (MAC-MPX3A: マックサイエンス製)</p> 	
手数料 (平成21年)	<ul style="list-style-type: none"> ・エックス線回折 2,940円/(1試料) × 2試料 ・試料調整(機械加工) 450円(1試料) × 2試料 	
担当部署	中央研究所 評価技術課 0766-21-2121	